

X آشکارسازی و جذب اشعه

هدف آزمایش:

آشنایی با روش تولید اشعه X

آشنایی با روش آشکارسازی اشعه X

بررسی وابستگی شدت عبوری اشعه X به ضخامت مانع

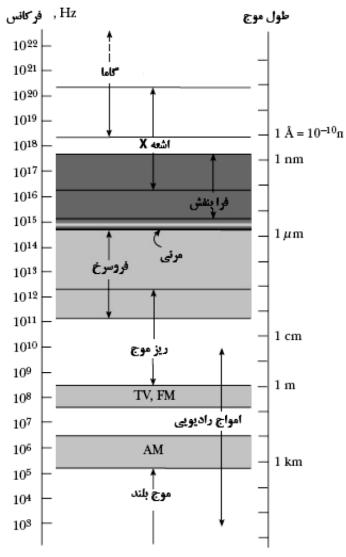
بررسی وابستگی شدت عبوری اشعه X به عدد اتمی (نوع) مانع

اعظم ایرجی زاد

بهار ۱۴۰۰

سوالات آزمایش آشکارسازی و جذب اشعهٔ ایکس

- 1- نحوه ایجاد و کاربردهاي اشعه X را توضیح د هید
 - 2- آشكارساز گايگر چگونه كار مى كند؟
- 3- امو اج الكترومغناطيسى طى چه فر آيندهايى با يك ورق ف فلزى و اكنش مى د هند ؟
 - 4 شدت عبوری پرتو ایکس از ورقهٔ فلزی چه رابطه ای با فخامت و نوع آن ورقه د ارد ?

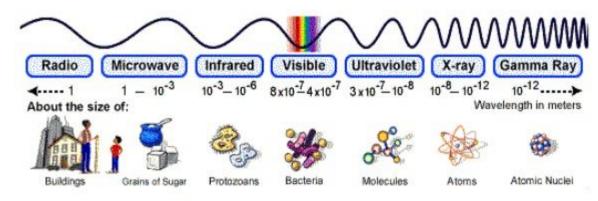


شکل ۱. دستهبندی حوزههای امواج الکترومغتاطیسی

اشعه ایکس

Electromagnetic spectrum

X-rays are electromagnetic radiation of exactly the same nature as light but of very much shorter wavelength



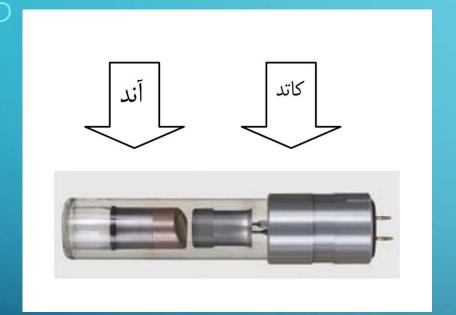
Unit of measurement in x-ray region is Å and nm.

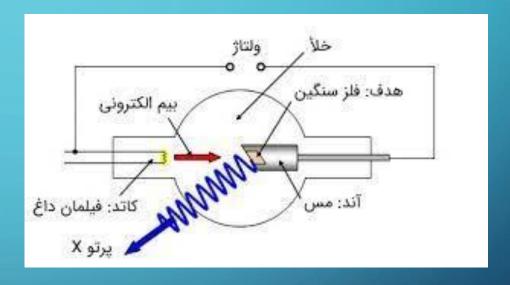
1 Å = 10-10 m, 1 nm = 10 Å = 10-9 m

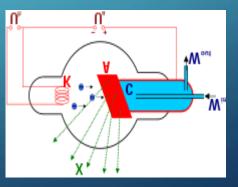
X-ray wavelengths are in the range 0.5 - 2.5 Å.

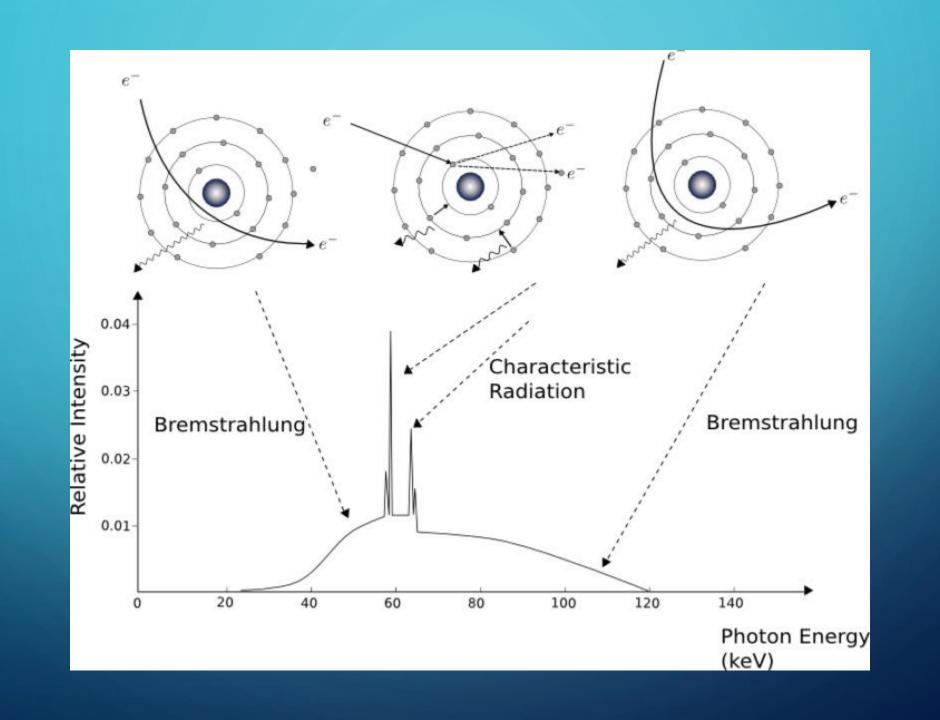
Wavelength of visible light ~ 6000 Å.

توليد اشعه ايكس

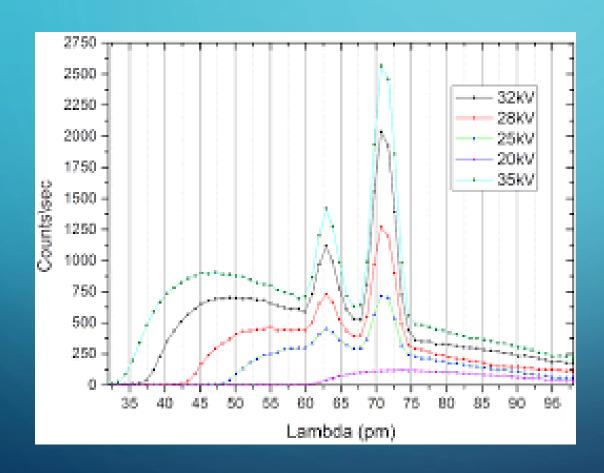








X-RAY SPECTRA



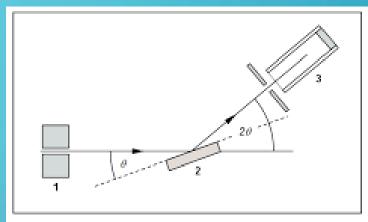
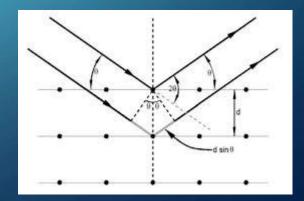


Figure 2: Diagram showing the principle of x-ray diffraction at a monocrystal and 20 coupling between counter-tube angle and scattering angle (glancing angle).

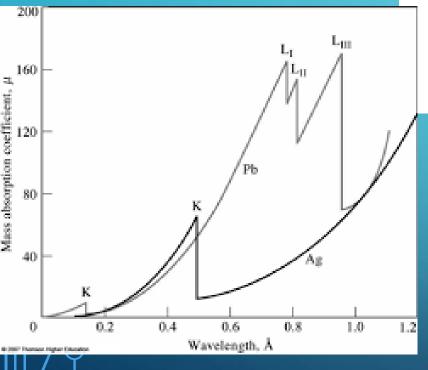
- 1: Collimator
- 2: Monocrystal
- 3: Counter tube



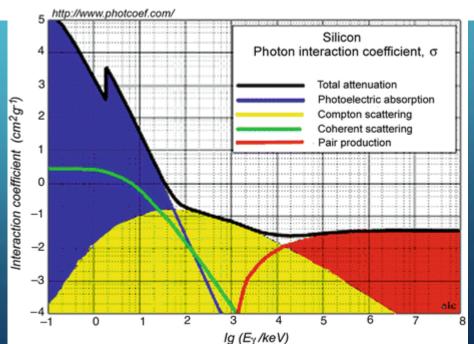
۳– جذب اشعه X:

شدت امواج الکترومغناطیسی به صورتهای مختلف میتواند کاهش یابد که از چهار حالت زیر خارج نمیباشد:

- ۱- فوتوالکتریک (جذب کامل یک فوتون و انتقال انرژی آن به الکترون)
- ۲- کامپتون (پراکندگی فوتون که منجر به کاهش انرژی فوتون خروجی میشود)
 - ۳- تامسون (پراکندگی الاستیک فوتون بدون کاهش انرژی فوتون خروجی)
 - ۴- تولید زوج (تبدیل حداقل دو فوتون (چرا؟) به حداقل یک ذره و پاد ذره)



 $I = I_0 e^{-(\frac{\mu}{\rho})\rho x}$

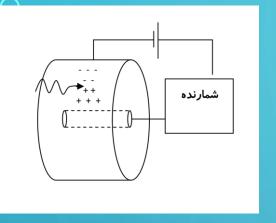


الف) وابستگی به ضخامت ماده

ب) وابستگی به نوع ماده

شرح آزمایش:

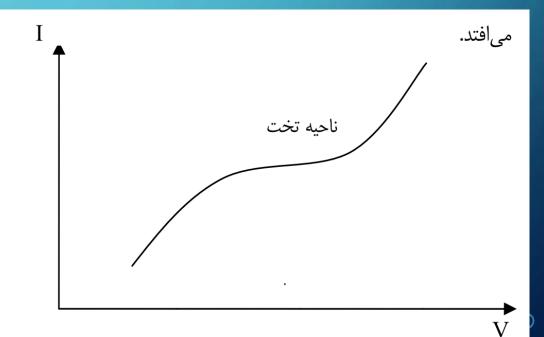
آزمایش ۱: بررسی ناحیه کار گایگر و کالیبره کردن آن





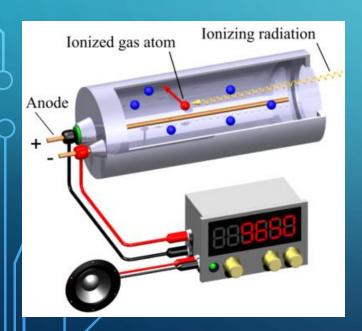


شکل ۷ .دستگاه تنظیم ولتاژ و تقویت گایگر

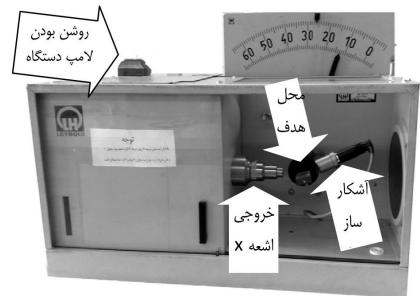


شکل ٤. نمودار جریان عبوری از گایگر بر حسب ولتاژ وناحیه

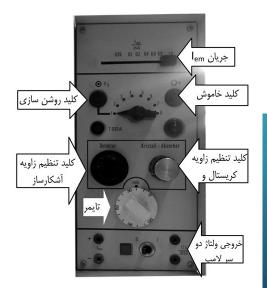
Ĩ 1/ 11



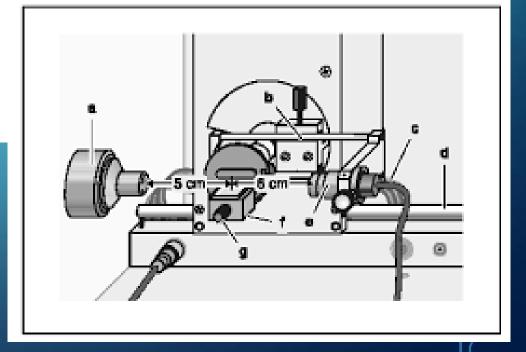


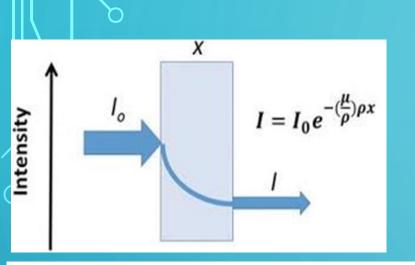


شکل ٥. محفظه تولید اشعه و چشم گایگر



شکل ٦. پنل تنظیمات محفظه تولید اشعه و چشم گایگر





آزمایش ۲: بررسی شدت عبوری به ضخامت مانع:

۱- با استفاده از دادههای جدول ۱ منحنی I/I_0 را بر حسب ضخامت آلومینیم در یک کاغذ نیملگاریتمی رسم کنید. منحنی را تفسیر کنید. (ضریب جذب را برای طول موج $0.71A^\circ$ بهدست آورید.)



شکل ۹. ضخامتهای مختلف اَلومینیم در مسیر پرتو اشعه x و در مقابل اَشکارساز گایگر

جدول ۱ شدت دریافتی پس از عبور اشعه X از ضخامتهای مختلف آلومینیم.

$(U = 21 \text{ kV}, I = 0.05 \text{ mA}, \Delta t = 100 \text{ s})$

d(mm)	I With Zr	I Without Zr
0	969.4	977.9
0.5	426.1	428.6
1	197.3	210.1
1.5	84.29	106.1
2	40.51	49.1
2.5	19.48	30.55
3	9.52	16.11

مقد ار ضریب جذب به دست آمده را با مقد ار جذب موجود در جد اول بین المللی کریستالوگر افی X-ray مقایسه نمایید.

μ= 13.46 cm⁻¹
J.L. Lawrence, ACTA CRYSTALLOGR A
35.5 (1979): 845-848.

Background effect $R_1 = 0.243 \text{ s}^{-1}$



شکل ۸. ورقه زیر کونیم در مسیر پرتو اشعه X

تکفام کردن اشعه ایکس با گذاشتن فیلتر زیرکونیوم (رقع نازک و حذف طبف U = 30 kV, d = 0.05 cm, without zirconium filter

Absorber	Z	I/mA	Δt/s	I(intensity)/s ⁻¹	T(I/I _o)	μ
none	0	0.02	30	1841		
С	6	0.02	30	1801		
Al	13	0.02	30	1164		
Fe	26	1	300	93.3		
Cu	29	1	300	16.63		
Zr	40	1	300	194.3		
Ag	47	1	300	106		

آزمایش ۳: بررسی شدت عبوری به نوع مانع:

با استفاده از دادههای جدول ۲ منحنی μ را بر حسب عدد اتمی رسم کنید و منحنی را تفسیر کنید.

سوال: علت كم كردن جريان ادر Z هاى كوچك چيست؟

جدول ۲ شدت دریافتی پس از عبور اشعه X از فلزات مختلف.

U = 30 kV, d = 0.05 cm, with zirconium filter

Absorber	Z	I/mA	Δt/s	I(intensity)/s ⁻¹	T(I/I ₀)	μ
none	0	0.02	30	718.3		
С	6	0.02	30	698.4		
Al	13	0.02	30	406.1		
Fe	26	1	300	29.24		
Cu	29	1	300	6.016		
Zr	40	1	300	113.9		
Ag	47	1	300	24.52		

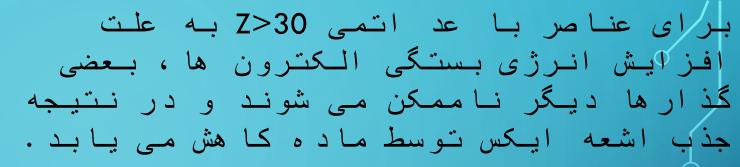
$$\sqrt{\frac{E}{Ry}} = (Z - \sigma_{2,1}) \sqrt{\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)}$$
 (II)

Here the numerical value of Ry is $Ry = Rhc \approx 2.18 \cdot 10^{-18} \text{ J}$ $\approx 13.6 \text{ eV}$.

For the $K\alpha$ -lines of the lighter elements (Z<30) the atomic screening constant is $\sigma_{2.1} \approx 1$ and therefore

$$\sqrt{\frac{E}{Ry}} = (Z - 1)\sqrt{\frac{3}{4}}$$
 (III).

With increasing atomic number, $\sigma_{2,1}$ becomes smaller and for $Z \ge 55$ it even becomes negative, i.e. at (?) these Z the influence of the outer electrons exceeds the screening effect of the inner electrons.



Tab. 1 Experimentally determined energies E of the K-lines and the atomic screening constants $\sigma_{i,j}$ for the corresponding electron transitions.

		Kα-line			Kβ-line		
Element	Z	E, keV	$\sqrt{\frac{E}{Ry}}$	$\sigma_{2,1}$	E, keV	$\sqrt{\frac{E}{Ry}}$	$\sigma_{3,1}$
Ti	22	4.47	18.13	1.07	4.89	18.96	1.89
Fe	26	6.40	21.69	0.95	7.05	22.77	1.85
Ni	28	7.48	23.45	0.92	8.28	24.67	1.83
Cu	29	8.06	24.34	0.89	8.92	25.61	1.84
Zn	30	8.66	25.23	0.86	9.60	26.57	1.82
Zr	40	15.80	34.08	0.64	17.70	36.08	1.74
Мо	42	17.48	35.85	0.60	19.61	37.97	1.72
Ag	47	21.98	40.20	0.58	24.68	42.60	1.81

FURTHER CALCULATIONS

$$Z_{\text{eff}} = Z - \sigma_{\text{n}}$$

$$E_n = -Rhc \, \frac{(Z - \sigma_n)^2}{n^2}$$

$$v = (E_2 - E_1)/h$$

$$v = cR \left[\frac{(Z - \sigma_{n1})^2}{n_1^2} - \frac{(Z - \sigma_{n2})^2}{n_2^2} \right]$$

$$\sqrt{\frac{v}{v_R}} = (Z - \sigma_{2,1}) \sqrt{\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)}$$
,

with R being the Rydberg constant, $R = m_e e^4 / 8 \varepsilon_0^2 h^3 c$. The principal quantum number n refers to the electron shells: n = 1 for the K-shell, n = 2 for the L-shell, n = 3 for the M-shell etc. This formula describes the energy structure of an electron in an inner shell. The atomic screening constant σ_n in general depends on n and Z.

If instead of σ_{n1} and σ_{n2} a single average atomic screening constant $\sigma_{2,1}$ is introduced for the transitions from n_2 to n_1 , this formula can be re-written as *Moseley's law*:

در زمان انجام آزمایش به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. با استفاده از آزمایش اول منحنی شدت رسیده به آشکارساز بر حسب ولتاژ گایگر را رسم کنید. هر ناحیه را تفسیر کرده و ناحیه کار گایگر را مشخص کنید. چرا در آزمایشهای بعدی از این ناحیه استفاده می کنید؟

۲. با افزایش ضخامت ورقه آلومینیمی شدت اشعه X چه تغییری می کند؟

۳. آیا شدت دریافتی پس از عبور اشعه X از فلزات مختلف روندی منطقی دارد؟ نتایج را تفسیر کنید.

 I/I_0 را بر حسب ضخامت آلومینیم در یک کاغذ نیملگاریتمی رسم استفاده از دادههای جدول ۱ منحنی را برای طول موج $0.71A^\circ$ بهدست آورید.)

۲- با استفاده از دادههای جدول ۲ منحنی μ را بر حسب عدد اتمی رسم کنید و منحنی را تفسیر کنید.

۳- عوامل خطا را ذکر کنید. خطای سیستماتیک را وارد نتیجه آزمایش کنید.

۴- نحوه ایجاد و کاربردهای اشعه x را توضیح دهید.

۵- از بررسی جذب اشعه x چه کمیاتی را می توان یافت؟ نتایج این آزمایش چه کاربردهایی دارد؟

۶- آیا جذب اشعه x به طول موج بستگی دارد؟ توضیح دهید.

۷- پالسهای زمینه ناشی از چه منابعی هستند؟

۸- فوتونها از طریق چهار فرایند متفاوت می توانند با اتمهای یک ورقه برهم کنش داشته باشند: فوتوالکتریک، تولید زوج، تامسون، کامپتون. دو فرایند اول فوتونها را کاملا جذب می کنند، در حالی که دو فرانید آخر تنها آنها را پراکنده می کنند. البته تمام فرایندها فوتونها را از باریکهی موازی دور می سازند. اینکه تحت مجموعهای از شرایط مفروض شانس وقوع کدام فرایند بیشتر است، از اهمیت نظری و عملی قابل توجهی برخوردار است. این شانس یا احتمال وقوع با چهار سطح مقطع بیان می شود.

الف) در مورد مفاهیم سطح مقطع پراکندگی، سطح مقطع فتوالکتریک، سطح مقطع تولید زوج و سطح مقطع کل بحث کنید.

ب) منحنی این چهار سطح مقطع را بر حسب انرژی فوتون فرودی رسم کرده و آن را تفسیر کنید.

سو الات آزمایش بررسی پراش اشعه ایکس و اثر کامپتون

1- علت استفاده از بلور در اندازه گیری طول موج اشعه ایکس چیست؟ از کدام بلور در این آزمایش استفاده می شود؟

2- اثر کامپتون چیست؟ آیا با فیزیک کلاسیک قابل توجیه است؟ توضیح د هید .

3- چرا در این آزمایش از ورقهٔ زیرکونیم به عنوان فیلتر استفاده می شود؟

4- ورقهٔ مسی در مشاهدهٔ اثر کامپتون چه کاربردی دارد؟ توضیح د هید.